## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# I ERBOR BUINDER BERUND KOM BOUN BERUN BERUN EIN IN EN BOUN BOUN BOUN HERBEITEN BERU BERUN HER HER EINE

### (43) 国際公開日 2005 年5 月6 日 (06.05.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/040784 A1

(51) 国際特許分類7:

....

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015415

G01N 27/416, 27/327

(22) 国際出願日:

2004年10月19日(19.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-368888

2003年10月29日(29.10.2003) 刀

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): アークレイ株式会社 (ARKRAY, INC.) [JP/JP]; 〒6018045 京都府京都市南区東九条西明田町 5 7 Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川相 拓司 (KAWAI, Takuji) [JP/JP]; 〒6018045 京都府京都市南 区東九条西明田町 5 7 アークレイ株式会社内 Kyoto (JP).

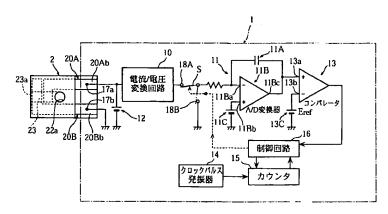
(74) 代理人: 吉田 稔, 外(YOSHIDA, Minoru et al.); 〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番 32-1301 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有]

(54) Title: SPECIMEN ANALYSIS METHOD AND SPECIMEN ANALYSIS DEVICE

(54) 発明の名称: 試料分析方法、および試料分析装置



10 CURRENT/VOLTAGE CONVERTING CIRCUIT

11Bd A/D CONVERTER

13 COMPARATOR

14 CLOCK PULSE OSCILLATOR

15 COUNTER

16 CONTROL CIRCUIT

(57) Abstract: A specimen analysis method and a specimen analysis device for analyzing a specimen by utilizing a double integral circuit (11) outputting a physical quantity correlated to an output from an analyzing instrument (2). Time intervals between the start of the input of the output from the analyzing instrument (2) to the double integral circuit (11) and the start of the output of the physical quantity from the double integral circuit (11) obtained before and after it is confirmed that the specimen is supplied to the analyzing instrument (2) are differentiated from each other.

(57) 要約: 本発明は、分析用具(2)からの出力に相関した物理量を出力する2重積分回路(11)を利用して試料を分析する技術に関する。本発明では、2重積分回路(11)に対する分析用具(2)の出力の入力開始から2重積分回路(11)からの物理量の出力開始までの時間間隔を、分析用具(2)に試料が供給され



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, のガイダンスノート」を参照。

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語